MATERIALE DIELECTRICE SOLIDE

1.Scopul lucrării

Scopul acestei lucrari de laborator este insusirea metodei de determinare a permitivitatii complexe relative a materialelor dielectrice uzuale si analiza comportarii acesteia in fecventa.

2.Conspectul lucrării

Dielectricii sunt materiale care se caracterizeaza prin stari de polarizatie cu functie de utilizare. Prin stare de polarizatie se intelege starea materiei caracterizata prin momentul electric al unitatii de volum diferit de 0. Starea de polarizatie poate fi temporara sau de orientare dipolara. In domeniul liniar, interactiunea unui dielectric izotrop cu campul electric este caracterizata de permitivitatea complexa relativa:

$$\underline{\varepsilon}_r = \underline{D}/(\varepsilon_0 \underline{E}) = \varepsilon_r - j\varepsilon_r$$

Daca un material cu permitivitatea complexa relativa $\underline{\varepsilon}_r$ se introduce intre armaturile unui condensator care are capacitatea C_0 in vid, atunci admitanta la bornele condensatorului astfel format are expresia : $\underline{Y} = \omega \varepsilon_r^r C_0 + j\omega \varepsilon_r^r C_0$. Din schema echivalenta a condensatorului format se observa ca partea reala a permitivitatii complexe relative caracterizeaza dielectricul din punct de vedere al proprietatilor sale de a se polariza, iar partea imaginara a permitivitatii complexe relative ε_r^r caracterizeaza dielectricul din punct de vedere al pierderilor de energie in material, pierderi modelate prin rezistenta $R_e = 1/(\omega \varepsilon_r^r C_0)$.

In diagrama fazoriala, complementarul unghiul dintre tensiunea aplicata \underline{U} condensatorului si curentul \underline{I} care il strabate se numeste unghi de pierderi a materialului dielectric si se noteaza cu δ . Se defineste tangenta unghiului de pierderi a materialului dielectric tg $\delta = \varepsilon_r^n/\varepsilon_r$, iar inversul tangentei unghiului de pierderi se numeste factor de calitate al materialului dielectric si se noteaza cu $Q\varepsilon = \varepsilon_r^n/\varepsilon_r^n$.

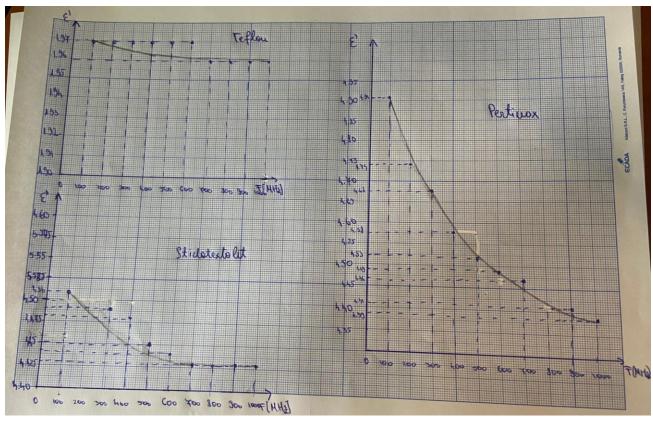
Datorita structurii fizice si fenomenelor complexe ce se petrec in dielectric cand asupra acestuia se aplica un camp electric, permitivitatea dielectrica reala si tangenta unghiului de pierderi sunt dependente puternic de frecventa si temperatura.

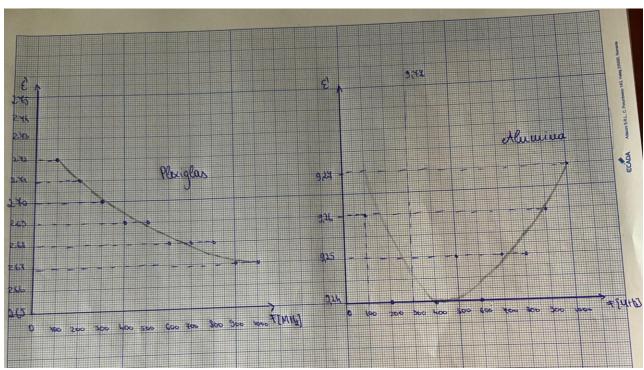
3.Desfășurarea lucrării

Se măsoară permitivitatea complexă, partea reală și imaginară ale acesteia și tangenta unghiului de pierderi, pentru următoarele materiale: politetrafluoretilena (teflon), polimetacrilat de metil (plexiglas), stratificat pe bază de hârtie (pertinax), stratificat pe bază de sticlă (sticlotextolit) și a oxidului de aluminiu (alumina) în gama de frecvențe de la 100 MHz la 1GHz.

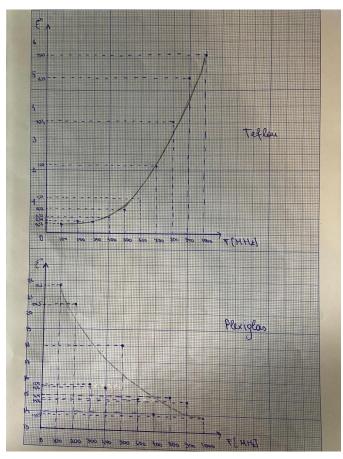
F [MHz]		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	ε'	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96
	E "r E r"	0.37	0.47	0.47	0.52	0.78	1.27	2.38	3.54	4.90	5.65
g=3mm											
	tgδ	0.18	0.24	0.24	0.26	0.39	0.64	1.21	1.8	2.5	2.88
	Q	5.55	4.16	4.16	3.85	2.56	1.56	0.83	0.55	0.4	0.35
			4.3	4.49	4.48	4.45	4.44	4.43	4.43	4.43	4.43
Sticlotextolit	ε "r εr "	98.3	91.6	83.7	84.6	85.3	86.3	86.7	85.8	85.5	85
g=1mm											
	tgδ	20.3	20.4	18.7		19.1		19.6	19.3	19.3	19
	Q	0.0492	0.049	0.0535	0.0532	0.0524	0.0508	0.051	0.0518	0.0518	0.0526
	ε'	4.91	4.74	4.68	4.58	4.53	4.49	4.46	4.53	4.41	4.39
Pertinax	ε "r εr "	314.7	300.1	285.4	280.4	280.8	278.3	273.4	270.2	288.1	264.9
g=0.95mm											
	tgδ	63.8	63.8	61.5	61.31	62.8	61.2	61.3	60.8	60.8	60.4
	Q	0.0156	0.0156	0.0162	0.0163	0.0159	0.0163	0.0163	0.0164	0.0164	0.0166
	ε'	2.72	2.71	2.7	2.69	2.69	2.68	2.68	2.68	2.67	2.67
Plexiglas g=2.1mm	E "r E T"	21.8	20.5	15.79	15.76	18	14.8	14	14.99	14.76	13.89
g-2.1111111	2~4	6 61	<i>c</i> 97	<i>6</i> 17	5 72	6 26	5 25	5 21	5 15	5 65	5.21
			6.87 0.146								
	Q ε'	0.151		0.162	0.175	0.159	0.187	0.188	0.183	0.177	0.192
Alumina				9.77	9.24	9.25	9.24	9.25	9.25	9.26	9.27
Alumina g=1mm	€″r <i>€</i> r"	4.54	4.59	_	_	_	_	_	_	_	-
	tgδ	296	299	_	_	_	_	_	_	_	_
	Q										

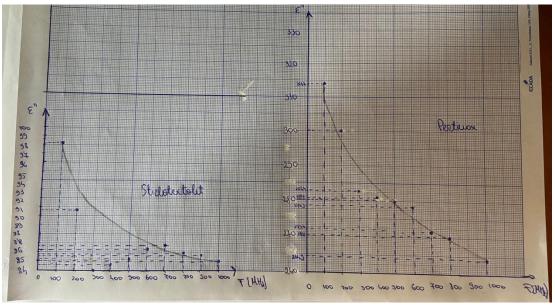
Partea reală a permitivității complexe relative în funcție de frecvență



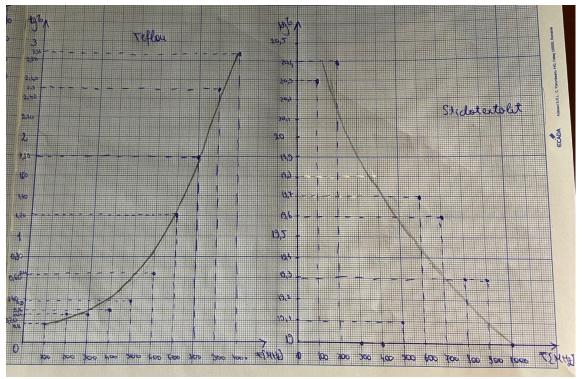


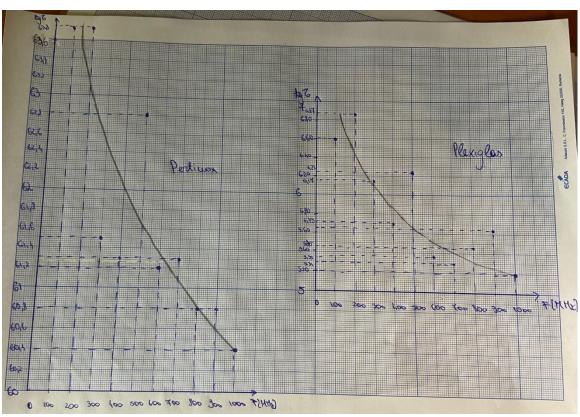
Partea imaginară a permitivității complexe relative în funcție de frecvență





Tangenta unghiului de pierderi a materialului dielectric în funcție de frecvență





Se masoara ε'_{r_1} , ε'_{r_2} al probelor de plexiglas si pertinax la frecventele date si rezultatele se trec in tabel. Se realizeaza din cele 2 probe un sandwich care se introduce intre electrozii dispozitivului de fixare si se masoara valorile la cele 3 valori ale frecventei.

	f [MI	100	500	800
Material				
Pertinax g=0.95mm	ε' _{r1}	4.91	4.53	4.53
Sticlotextolit g=1mm	ε' _{r2}	4.56	4.45	4.43
Sandwich Pertinax + Sticlotextolit	ε' _{masurat}	4.85	4.51	4.47
Sandwich pertinax + steclotextolit	ε' calculat	4.72	4.49	4.48
Sandwich pertinax + steclotextolit	ε' _{masurat} - ε' _{calculat}	0.13	0.02	-0.01

Valoarea măsurată e mai mare decât cea calculată, dar odată cu creșterea frecvenței, diferența dintre valoarea măsurată și cea calculată a lui ε_{re}' se micșorează.

4.Concluzie

Prin urmare, prin această lucrare am determinat valorile permitivității relative complexe ale diferitelor materiale utilizate în industria electronică la anumite frecvențe de lucru. Analizând comportarea lor într-un interval de frecvență dat am observat că valoarea părții reale, a părții imaginare a permitivității relative complexe și valoarea tangentei unghiului de pierderi scad cu creșterea frecvenței mai mult sau mai puțin, în funcție de materialul analizat.

5.Intrebari si probleme

1. Comentați comportarea materialelor măsurate în domeniul de frecvență utilizat.

Partea reală a permitivității complexe relative are o scadere semnificativa la pertinax, iar la restul materialelor rămâne aproape constantă la modificarea frecvenței.

Partea imaginară a permitivității relative complexe creste cu creșterea frecvenței la tefon, iar la restul materialelor scade.

Tangenta unghiului de pierderi scade odată cu creșterea frecvenței în cazul materialelor măsurate, mai puțin la teflon, unde tangenta unghiului de pierderi tinde să crească.

2. Să se deducă formula de calcul a tangentei unghiului de pierderi echivalente a două condensatoare legate în paralel şi în serie când se cunoaște capacitatea şi tangenta unghiului de pierderi pentru fiecare condensator.

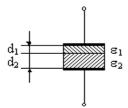
Condensatoare legate in serie:

$$\begin{split} & C_{es} = \frac{\text{C1*C2}}{\text{C1+C2}}; \qquad R_{es} = R_1 + R_2; \\ & tg\delta_1 = \omega^* C_1^* R_1 = > R_1 = \frac{tg\delta_1}{\omega^* C_1} \\ & tg\delta_2 = \omega^* C_2^* R_2 = > R_2 = \frac{tg\delta_2}{\omega^* C_2} \\ & tg\delta_{es} = \omega^* C_{es}^* R_{es} = \omega^* \frac{\text{C1*C2}}{\text{C1+C2}} * (\frac{tg\delta_1}{\omega^* C_1} + \frac{tg\delta_2}{\omega^* C_2}) = \frac{\text{C2*tg}\delta_1 + \text{C1*tg}\delta_2}{\text{C1+C2}} \end{split}$$

Condensatoare legate în paralel:

$$\begin{split} &C_{ep} \!\!=\!\! C_1 \!\!+\!\! C_2; &R_{ep} \!\!=\!\! \frac{R1*R2}{R1+R2}; \\ &tg\delta_1 \!\!=\!\! \frac{1}{\omega*C1*R1} \!\!=\!\! > R_1 \!\!=\!\! \frac{1}{\omega*C1*tg\delta_1} \\ &tg\delta_2 \!\!=\!\! \frac{1}{\omega*C2*R2} \!\!=\!\! > R_2 \!\!=\!\! \frac{1}{\omega*C2*tg\delta_2} \\ &tg\delta_{ep} \!\!=\!\! \frac{1}{\omega*Cep*Rep} \!\!=\!\! \frac{R1+R2}{\omega*(C1+C2)*R1*R2} \!\!=\!\! \frac{C1*tg\delta_1 + C2*tg\delta_2}{C1+C2} \end{split}$$

3. Să se calculeze permitivitatea complexă echivalentă a unui dielectric format din două straturi de materiale diferite, când se cunoaște permitivitatea complexă a fiecăruia (vezi Fig. 1-6).



$$C_e = \frac{C1*C2}{C1+C2}$$

$$C_1 = \frac{\mathcal{E}_{1*S}}{d_1} \qquad \qquad C_2 = \frac{\mathcal{E}_{2*S}}{d_2}$$

$$C_e = \frac{\mathcal{E}e*S}{d1+d2}$$

$$C_{e} - \underbrace{\frac{\varepsilon_{1}*s}{\frac{\ell_{1}}{d1}}*\frac{\varepsilon_{2}*s}{\frac{\ell_{2}}{d2}}}_{d1} - \underbrace{\frac{\varepsilon_{e}*s}{d1+d2}}_{d1+d2} = > \underbrace{\frac{\varepsilon_{1}*\varepsilon_{2}*s}{\varepsilon_{1}*d2+\varepsilon_{2}*d1}}_{\varepsilon_{1}*d2+\varepsilon_{2}*d1} - \underbrace{\frac{\varepsilon_{e}*s}{d1+d2}}_{\varepsilon_{1}*d2+\varepsilon_{2}*d1} = > \varepsilon_{e} - \underbrace{\frac{\varepsilon_{1}*\varepsilon_{2}*s}{\varepsilon_{1}*d2+\varepsilon_{2}*d1}}_{\varepsilon_{1}*d2+\varepsilon_{2}*d1}$$

Fig. 1-6.

4. Dacă ε_1 = 2.1, ε_2 = 3.5 si g_1 = (1/4)· g_2 , să se determine ε echivalent pentru structura din Fig. 1-7.

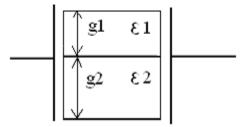


Fig 1-7.

$$\epsilon'_{\text{rechivalent}} = \frac{g1 + g2}{\frac{g1}{\epsilon' r_1} + \frac{g2}{\epsilon' r_2}} = \frac{\frac{1}{4}g2 + g2}{\frac{1}{4}g2} = \frac{\frac{5}{4}g2}{\frac{1}{2}(r_1 + \frac{g2}{\epsilon' r_2})} = \frac{\frac{5}{4}g2}{\frac{g2}{8.4} + \frac{g2}{3.5}} = \frac{\frac{5}{4}}{0.119 + 0.285} = \frac{1.25}{0.404} = 3.09$$

5. Determinați valoarea părții reale a permitivității complexe relative ϵ'_{r1} a unei probe de mică cu grosimea de 0,1mm cu ajutorul unei probe de teflon cu grosime de 0.8mm și ϵ'_{r2} = 2.1 și $\epsilon'_{rechivalent}$ = 2.23.

$$\epsilon'_{rechivalent} = \frac{\frac{g1+g2}{\frac{g1}{\mathcal{E}'r_1} + \frac{g2}{\mathcal{E}'r_2}} = > \frac{g1}{\mathcal{E}'r_1} = \frac{g1+g2}{\mathcal{E}'r_2} - \frac{g2}{\mathcal{E}'r_2} = > \mathcal{E}'r_1 = \frac{g1}{\frac{g1+g2}{\mathcal{E}'r_2} - \frac{g2}{\mathcal{E}'r_2}} = 5$$

6. Între armăturile condensatorului plan - paralel cu capacitatea în vid de C_0 = 100pF, se introduce un dielectric având permitivitatea relativă complexă cu termenii ε_r' =5 si ε_r'' =5· 10^{-4} ; să se calculeze admitanța și elementele schemei echivalente paralel pentru condensatorul astfel obținut, la frecvența de 1MHz.

$$\underline{Y} = j\omega \underline{\varepsilon_r} C_0 = j\omega (\varepsilon_r' - j\varepsilon_r'') C_0 = \omega \varepsilon_r'' C_0 + j\omega \varepsilon_r' C_0$$

$$= 2\pi f \varepsilon_r'' C_0 + j2\pi f \varepsilon_r' C_0 = 2\pi f C_0 (\varepsilon_r'' + j\varepsilon_r')$$

$$= 2*\pi*10^6*100*10^{-12} (5\cdot10^{-4} + 5j) = 2*\pi*10^{-4} (5\cdot10^{-4} + 5j) = 6.28*10^{-4} (5\cdot10^{-4} + 5j)$$

$$= 31.4*10^{-8} + 31.4j*10^{-4}$$

$$C_e = \mathcal{E}'_r * C_0 = 5*100*10^{-12} = 500 \text{ pF}$$

$$R_e = \frac{1}{\omega * \mathcal{E}'' r * C_0} = \frac{1}{2\pi * 10^6 * 5 \cdot 10^{-4} * 100 * 10^{-12}} = 3.18 \text{ M}\Omega$$

7. Pentru acelaşi condensator cu dielectricul între armături, să se calculeze factorul de calitate Q şi tangenta unghiului de pierderi $tg\delta$, la frecvenţa de 1MHz .

$$Q = \omega^* C_e * R_e = 2*\pi*10^6*500*10^{-12}*3.18*10^6 = 31800\pi = 9985.2$$

$$tg\delta = \frac{1}{0} = 0.1*10^{-3}$$

- 8. Între armăturile unui condensator plan paralel cu capacitatea în vid C $_0$ = 68 pF, se introduce un dielectric având permitivitatea relativă complexă cu termenii ϵ_r' =3,5 şi ϵ_r'' =4· 10 ϵ_r'' =4· 10
- a) să se calculeze admitanța și elementele schemei echivalente paralel pentru condensatorul astfel obținut, la frecvențele de 500 kHz și 5 MHz; comentați rezultatele.

Frecvenţa de 500 kHz:

$$\underline{Y} = j\omega \underline{\varepsilon_r} C_0 = j\omega (\varepsilon_r' - j\varepsilon_r'') C_0 = \omega \varepsilon_r'' C_0 + j\omega \varepsilon_r' C_0$$

$$= 2\pi f \varepsilon_r'' C_0 + j2\pi f \varepsilon_r' C_0 = 2\pi f C_0 (\varepsilon_r'' + j\varepsilon_r'') =$$

$$= 2*3.14*500*10^3*68*10^{-12}*(4\cdot10^{-4} + 3.5j) =$$

$$= 2.135*10^{-4}*(4\cdot10^{-4} + 3.5j)$$

$$C_e = \mathcal{E}_r'' C_0 = 3.5*68*10^{-12} = 238 \text{ pF}$$

$$R_e = \frac{1}{\omega * \varepsilon_r'' r * C_0} = \frac{1}{2*\pi * 500*10^3 * 4*10^{-4} * 68*10^{-12}} = 11.7 \text{ M}\Omega$$

Frecvența de 5 MHz:

$$\underline{Y} = j\omega \underline{\varepsilon_r} C_0 = j\omega (\varepsilon_r' - j\varepsilon_r'') C_0 = \omega \varepsilon_r'' C_0 + j\omega \varepsilon_r' C_0$$

$$= 2\pi f \varepsilon_r'' C_0 + j2\pi f \varepsilon_r' C_0 = 2\pi f C_0 (\varepsilon_r'' + j\varepsilon_r') =$$

$$= 2*3.14*5*10^6*68*10^{-12}*(4\cdot10^{-4} + 3.5j) =$$

$$= 2.135*10^{-3*}(4\cdot10^{-4} + 3.5j)$$

$$C_e = \mathcal{E}_r^* C_0 = 3.5*68*10^{-12} = 238 \text{ pF}$$

$$R_e = \frac{1}{\omega * \mathcal{E}_r'' r * C_0} = \frac{1}{2*\pi * 5*10^6 * 4*10^{-4} * 68*10^{-12}} = 1.17 \text{ M}\Omega$$

b) să se calculeze factorul de calitate Q și tangenta unghiului de pierderi $tg\delta$, la frecvențele de 500 kHz și 5 MHz; comentați rezultatele.

Frecvența de 500 kHz:

$$\begin{split} Q = & \omega^* C_e * R_e = 2*\pi*500*10^3*238*10^{\text{-}12}*11.7*10^6 = 8743.6*10^{\text{-}3} \\ tg \delta = \frac{1}{Q} = 0.11 \end{split}$$

Frecvenţa de 5 MHz:

$$Q = \omega * C_e * R_e = 2*\pi*5*10^6*238*10^{-12}*1.17*10^6 = 8743.6$$

$$tg\delta = 0.11*10^{-3}$$